



中华人民共和国国家标准

GB/T 18858.7—2014/IEC/PAS 62026-7:2009

低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口(CDI) 第7部分:CompoNet

Low-voltage switchgear and controlgear—Controller-device
interfaces(CDIs)—Part 7: CompoNet

(IEC/PAS 62026 7:2009, IDT)

2014-06-24 发布

2015-01-22 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

目 次

前言	I
引言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语、定义、符号和缩略语	2
4 分类	6
5 特性	9
6 产品信息	103
7 常规服务、安装和运输条件.....	103
8 结构和性能要求	104
9 测试	138
附录 A (规范性附录) CompoNet 公共服务	149
附录 B (规范性附录) CompoNet 出错代码	150
附录 C (规范性附录) 连接路径属性定义	151
附录 D (规范性附录) 数据类型规范和编码	152
附录 E (规范性附录) 通信对象库	155
附录 F (规范性附录) 值的范围	156
附录 G (规范性附录) CN 默认时间域.....	157
参考文献.....	161

前 言

GB/T 18858《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口》分为以下部分：

- 第 1 部分：总则；
- 第 2 部分：执行器传感器接口(AS-i)；
- 第 3 部分：DeviceNet；
- 第 7 部分：CompoNet。

本部分是 GB/T 18858 的第 7 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分与 GB/T 18858.1《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口 第 1 部分：总则》一起使用。

本部分等同采用 IEC/PAS 62026-7:2009《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口 第 7 部分：CompoNet》，本部分在技术内容和编写格式上与 IEC/PAS 62026-7:2009《低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口 第 7 部分：CompoNet》一致。

与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

- GB/T 5095.1—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第 1 部分：总则(idt IEC 60512-1:1994)
- GB 4208—2008 外壳防护等级(IP 代码)(IEC 60529:2001, IDT)
- GB/T 17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC 61000-4-2:2001, IDT)
- GB/T 17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC 61000-4-3:2002, IDT)
- GB/T 17626.4—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC 61000-4-4:2004, IDT)
- GB/T 17626.5—2008 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC 61000-4-5:2005, IDT)
- GB/T 17626.6—2008 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度(IEC 61000-4-6:2006, IDT)
- GB/T 15969.2—2008 可编程序控制器 第 2 部分：设备要求和测试(IEC 61131-2:2007, IDT)
- GB/T 18858.1—2002 低压开关设备和控制设备 控制器-设备接口(CDI) 第 1 部分：总则(IEC 62026-1:2000, IDT)
- GB/T 9387.1—1998 信息技术 开放系统互连 基本参考模型 第 1 部分：基本模型(idt ISO/IEC 7498-1:1994)
- GB 4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值 and 测量方法(CISPR11:2010, IDT)

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国低压电器标准化技术委员会(SAC/TC 189)归口。

本部分主要起草单位：上海电器科学研究院。